

1. DIFFRATTOMETRI

Diffratometro a Raggi X per monocristallo modello Nonius Kappa-CCD: consente la determinazione delle strutture cristalline e molecolari di composti organici, organometallici ed inorganici e di minerali. Lo strumento è equipaggiato con un goniometro a geometria Kappa, da una sorgente tradizionale di raggi-X (anodo al Mo) e da un detector CCD bidimensionale. Il diffratometro è inoltre fornito di un sistema a bassa temperatura: **Cryostream Cooler Oxford 600** (100K with 373K) e di un sistema ad alta temperatura: **Gas Blower GSB 1300** che permette di lavorare fino a 1200K.



Diffratometro a Raggi X per polveri modello Bruker D8 Advance per l'analisi di composti chimici organici ed inorganici, di farmaci e di materiali utilizzando un tubo a raggi X con anodo al Cu e monocromatore a grafite. E' fornito di dispositivo Ground Incidence Diffraction (GID) per misure a basso angolo. **Software:** DIFFRACplus EVA per l'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle fasi, determinazione dei parametri di cella e delle dimensioni medie dei cristalliti, accoppiato con il data-base ICCD-PDF2. TOPAS per l'affinamento Rietveld.

